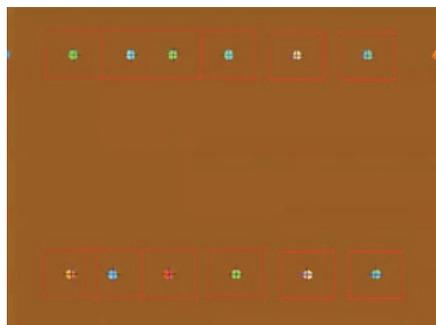


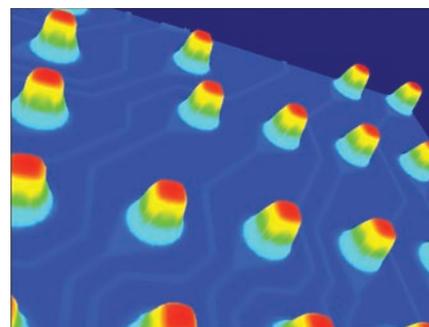
## プローブカード

プローブカードの微細なコンタクト部分のXYZ座標を、視野内一括測定します。



3D画像

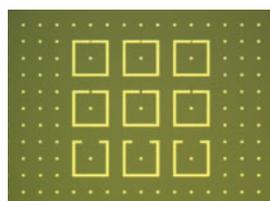
## ウェハレベルパッケージ



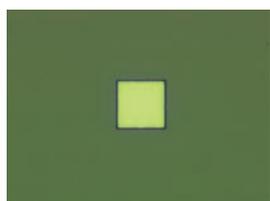
3Dビューソフトウェア (オプション) による鳥瞰図

## 微細配線パターン

変倍比15×のズーム機能を持つ明視野像による2次元測定と、3D画像による視野内の一括高さ測定を組み合わせることにより、多彩な測定シーケンスが実現できます。



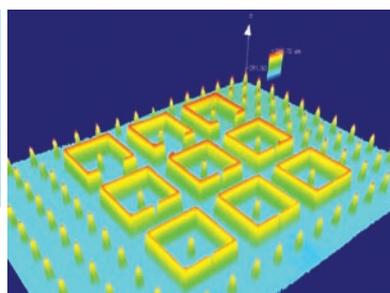
明視野像(最小ズーム)



明視野像(最大ズーム)

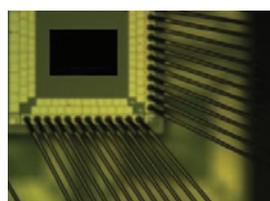


3D画像

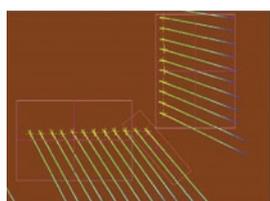


3Dビューソフトウェア (オプション) による鳥瞰図

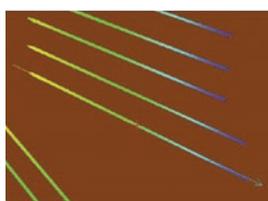
## ボンディングワイヤー



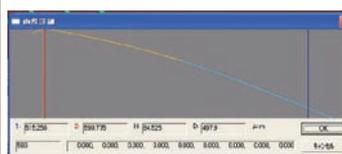
明視野像



3D画像：全ワイヤーの最高点を一括検出



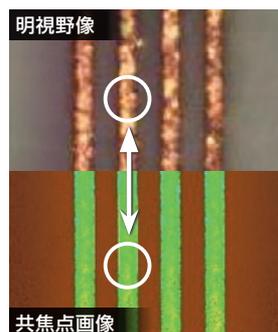
3D画像：ワイヤーの高さプロファイル表示



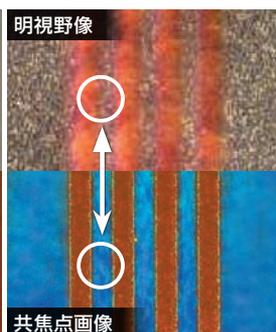
## 高コントラスト・段差のあるサンプル/透明度が高く薄いサンプルなどに最適

輝度差が激しいサンプル、光の反射が不安定な透明体サンプルなどは、明視野画像測定では正確な数値の取得が困難な場合があります。こうしたサンプルの観察時に共焦点光学系を用いることで、正確に形状/高さを捉え、検出できます。

### 高コントラストサンプル(プリント基板銅線)

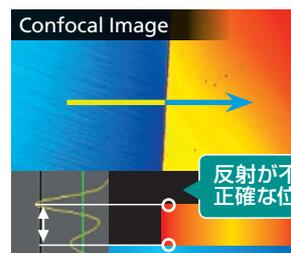


上部(高輝度)にフォーカス



下部(低輝度)にフォーカス

### 透明体サンプル(金属表面フィルム)



反射が不安定なため、正確な位置の検出が困難

表面と下面両方の高さを正確に検出できる

